

談話室

第20回表面科学基礎講座 —表面・界面分析の基礎と応用—

大谷 文章・奥野 和彦*

京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学教室
〒606-01 京都市左京区吉田本町

* (株) 東レリサーチセンター表面科学研究所
〒520 大津市園山 3-3-7

(1995年11月30日受理)

The 20th Surface Science Lecture Course

Bunsho OHTANI and Kazuhiko OKUNO*

Division of Energy and Hydrocarbon Chemistry,
Graduate School of Engineering,
Kyoto University, Kyoto 606-01

*Department of Surface Science,
Toray Research Center
3-3-7 Sonoyama, Ohtsu 520

(Received November 30, 1995)

表面科学基礎講座が秋季に関西地区で開催されるようになって5年目にあたる本年は、一昨年、昨年と同様に大阪駅近くの三田出版会を会場として11月9日と10日の二日間にわたり「表面・界面分析の基礎と応用」と題して開催された。依然きびしい昨今の経済情勢から、当初は大幅な参加者の減少を覚悟したが、本部企画委員会と関西支部幹事会のご尽力もあり、結局79名の受講者があった。会場の規模から考えて、ちょうどよい人数であったと感じられた。

前回までの基礎講座受講者からのアンケート結果を参

考にし、これまでと同じ内容で表面分析の基礎をじっくりと学んでいただけることを考え、昨年と同じ講師陣で臨んだ。具体的な内容は、下表のとおりである。二日間でこれだけの内容を実施するのは時間的に苦しいものがあるが、講師の方々のご配慮により、各講義とも時間内に基礎から一部最近の応用までカバーしたものになった。また、例年どおり、各講義の間には10分間の休憩を入れている。また、各講義の後に時間をもうけて質問を受け付けたほか、昨年度までと同じく質問票による質問・討議の話題提供を受け付けて、それぞれの日の最後に設定した討論時間にまとめて講師の応答を実施した。原理に関する問題から、実際の分析業務を行ううえでの問題点、あるいは事例をあげてどの分析法を選べよいかといった質問まで幅広い多くの質問が寄せられ、有意義な時間がもてた。

さて、今回のアンケート集計結果を見ると、ここ数年と同じ傾向が見られた。すなわち、参加の動機としては、基礎を勉強し直したい、という参加者が多く、本講座の開催頻度や開催時期、日数については、現状でよいとする声が多かった。例年同様の内容で継続しているこの講座のねらいが妥当であることを支持しているものと思われる。また、昨年までの参加者と同じ職場から参加者も多く、過去の参加者に対して行っている勧誘のダイレクトメールの効果が現れている。今後の基礎講座でとりあげてほしい分析技術・手段やとりくんでほしいもの(材料別の講座など)の意見もよせられているので、企画委員会において検討されていくこととなろう。

なお、1996年春季の基礎講座は、6月12日から3日間、東京の総評会館で開催されることになったので、これにも多くの方々の参加をお願いしたい。

最後に、本講座の企画・運営にご協力いただいた企画委員会、事務局、関西支部幹事会をはじめ関係者の方々に紙面を借りて深く感謝する。

第20回基礎講座プログラム (1995年11月9～10日)

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. 表面・界面分析概論 | 福田 安生(静大電子研) |
| 2. FT-IR, ラマン分光 | 石田 英之(東レリサーチセンター) |
| 3. 電子顕微鏡 (TEM) | 柴富 邦夫(日本電子) |
| 4. 電子線マイクロアナライザ (EPMA) | 平居 暉士(島津製作所) |
| 5. ラザフォード後方散乱 (RBS) | 吉岡 芳明(松下テクノリサーチ) |
| 6. 討論 | (福田, 石田, 柴富, 平居, 吉岡) |
| 7. 電子分光装置の基礎 | 大岩 烈(アルバック・ファイ) |
| 8. オージェ電子分光法 (AES) | 大村 卓一(松下テクノリサーチ) |
| 9. X 線光電子分光法 (XPS) | 添田 房美(東レリサーチセンター) |
| 10. 二次イオン質量分析法 (SIMS) | 工藤 正博(成蹊大) |
| 11. 走査プローブ顕微鏡 (STM/AFM) | 森田 清三(広大理) |
| 12. 討論 | (大岩, 大村, 添田, 工藤, 森田) |